

# 更新说明

(AccoTestSTS8200CROSSVersion1100build220419\_r p2.0)

## 新功能：

### 1、ZMU测量函数有效交流电平参数范围调整

**描述：**ZMU测量函数有效交流电平参数范围调整为0.005~1V。

### 2、DVX900自检功能优化

**描述：**DVX900模块IP自检项目流程优化。

### 3、PIM 系统的INF模块自检功能优化

**描述：**INF模块在自检异常情况下的超时时间优化。

### 4、8200校准对于通用框架添加板卡SN信息的获取优化

**描述：**完善校准模块对各板卡SN信息的显示的规则。

### 5、测试过程中MDB文件大于720MB处理方式升级

**描述：**支持大测试数据文件的存储，详细参见《AccoTEST SYSTEM软件使用手册》。

### 6、增加接口在InitBeforeTestFlow中获取工位是否测试的状态

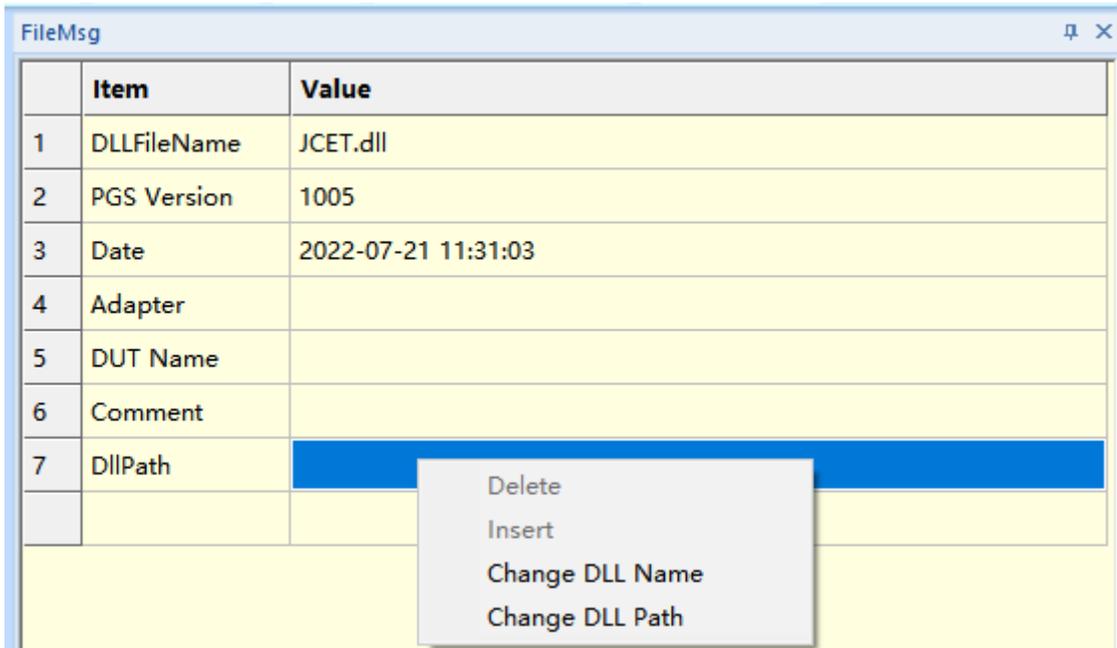
**描述：**增加接口STSGetSiteRunStatus用来获取待测试工位（界面设置有效工位与SOT有效工位的交集）。

### 7、改进获取LOT信息内容的测试接口函数实现方式

**描述：**改进接口函数STSGetLotInfo可以实时从上层TestUI获取到相关lot信息。

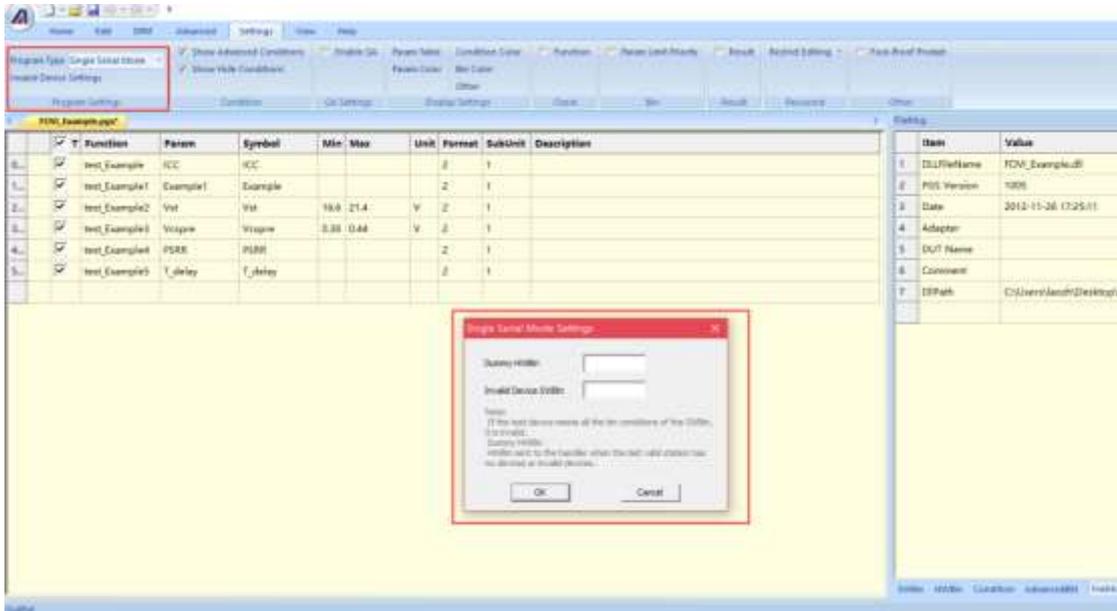
### 8、PGSEdit 3.0版本增加DLL路径设置

**描述：**界面增加DLL路径设置，目前需要设置完整路径。程序加载过程直接加载此路径的DLL文件。此功能需要PGS升级到1005版本才可以使用。



### 9、添加Single serial Mode测试模式

**描述：**添加SingleSerialMode测试模式，用于单SOT并发测试，详细参见《AccoTEST SYSTEM软件使用手册》。



## 修改的 Bug:

### 1. PGSEdit 3.0 不支持 SetQAStartFuncNum 接口设置问题

**描述:** 接口设置的 QA 起始函数未生效。

**风险:** QA 设置异常。

**解决办法:** 修改 QA 设置流程。

### 2. TestUI LOT 信息输入未实时更新问题

**描述:** 在 LOT 信息设置窗口界面通过粘贴更新 LOT 信息名称, 未能实时更新。

**风险:** 易用性差。

**解决办法:** 实现粘贴更新 LOT 信息名称功能。

### 3. 数据分析软件 PAT 设置输入框按键无效问题

**描述:** 在数据分析软件的 PAT 设置窗口界面, 一些输入框的功能按键无效, 例如 backspace、回格、删除键等无效。

**风险:** 易用性差。

**解决办法:** 去除限制, 使输入框的功能按键功能正常。

### 4. TestUI 手动测试与自动化测试 Wafer ID 信息有区别问题

**描述:** 测试程序 LDF 文件中从 Wafer ID 信息中删除 LOT ID 信息不勾选, 所以手动测试, 获取的 Wafer ID 信息是没有处理过的 Wafer ID 信息; 而自动化测试时, AutoLot.LDF 文件没有相关设置, 则从 Wafer ID 信息中删除 LOT ID 信息此设置缺省值为真, 导致自动化测试时, 获取的 Wafer ID 信息是删除了 LOT ID 信息的 Wafer ID 信息。

**风险:** 手动测试与自动化测试获取到的 Wafer ID 信息不一致。

**解决办法:** 增加自动化接口函数 SetTestProgramSettings、SetSubPath 解决差异化问题。

### 5. DIO\_PLUS 类 GetSerialPatternResult 接口获取结果异常

**描述:** 获取串行数据结果错行。

**风险:** 获取的数据错误。

**解决办法:** 修改代码。

6. NewLot 后待 retest 信息未清空问题

**描述:** NewLot 之后测试出现 others 统计。

**风险:** 有 others 器件。

**解决办法:** newlot 之后清空之前的器件信息。

7. Row Mode 界面显示 Part\_ID 与 Bin 信息重合问题

**描述:** 当 Part\_ID 设置较长时, 测试后 “Row Mode 界面显示 Part\_ID 与 Bin 信息重合。

**风险:** 无法通过界面准确地、快速地查看分 Bin 信息。

**解决办法:** 改进 Part\_ID 显示方法, 通过节略的方式显示较长的 Part\_ID。

8. 行显示模式在不同电脑显示异常问题

**描述:** 测试参数超过 350 个时, 在行模式显示方式下, 部分电脑显示测试数据信息空白。

**风险:** 行模式测试数据无法正确显示。

**解决办法:** 改进显示处理。

9. 异常弹框导致测试中断“致命的存储错误! 请关闭 TestUI 重庆”问题

**描述:** 在出现异常存储错误时, 中文提示错误。

**风险:** 造成用户困惑。

**解决办法:** 改进多语言包, 正确显示提示信息。

10. 数据分析软件 PAT 设置窗口存在界面显示问题

**描述:** 数据分析软件 PAT 设置窗口, 在设置 PAT 判据产生规则时, 当 PAT 判据大于原始判据时, 弹窗提示没有实时更新 PAT 判据值为原始判据 (此问题只在 AccoTestSTS8200CROSSVersion1100build220419\_r 及以后版本存在)。

**风险:** 界面显示问题, 数据处理无问题, 导致用户误解。

**解决办法:** 修改代码, 延续老版本的界面显示处理规则。

11. 测试工位统计不正确问题

**描述:** TestUI 界面显示的测试工位异常。

**风险:** 影响界面显示。

**解决办法：**修改返回的工位状态信息。

12. 对程序进行编译（执行代码分析）导致用户权限被修改问题

**描述：**代码检查工具加载 DLL 时影响用户权限获取模块。

**风险：**影响软件操作。

**解决办法：**加载 DLL 之前增加版本判断。

13. PGSEdit 3.0 复制函数后 Update 异常报错问题

**描述：**参数条件拷贝后，UpDate 导致 PGSEdit 异常退出。

**风险：**拷贝条件后程序异常退出。

**解决办法：**修改条件拷贝函数。

14. 数据分析软件离线 mapping 图显示数据错误

**描述：**打开 mapping 图，显示的数据与实际数据不一致。

**风险：**从 mapping 图中无法查看测试数据。

**解决办法：**修改 bug，解决问题。

15. DIO\_PLUS 类 SPISetWriteData 的数据进行 SPIRunAllSite 后修改未生效问题

**描述：**DIO\_PLUS 类多个实例对象，在做板卡同步运行时，未能正常运行获取到数据。

**风险：**获取数据不正确。

**解决办法：**修改代码解决。

16. Control 界面 System Option 选项界面布局异常问题

**描述：**Control 软件的 System Option 设置窗口，按钮过于靠近底部。

**风险：**界面布局别扭，影响软件美观。

**解决办法：**调整界面布局。

17. DIO\_PLUS 类 GetSerialPatternResult 在 StartSynRun 同步运行时，无法获取结果问题

**描述：**DIO\_PLUS 类实例化的多个对象，同步运行向量时，未能获取到正确的串行数据。

**风险：**获取串行数据错误。

**解决办法：**修改同步运行代码。

#### 18. 向量编辑器创建同名管脚分组问题

**描述：**向量编辑器中已经存在的管脚分组名，再次创建同名的管脚分组成功。

**风险：**存在同名的管脚分组。

**解决办法：**禁止创建同名分组。

#### 19. PGSEdit 3.0 多组 bin 信息时报错异常问题

**描述：**双击分档异常信息没有跳转到正确的错误位置。

**风险：**没有正常跳转。

**解决办法：**修改跳转的位置。

#### 20. PGSEdit 3.0 多组 limit 使用异常问题

**描述：**修改正在使用的 Limit，更新到 TestUI 失败。

**风险：**更新操作 limit 加载异常。

**解决办法：**修改 Limit 的加载流程。

#### 21. PGSEdit 3.0 多组分 bin 被异常删除问题

**描述：**列顺序调整时，漏掉了分档列。

**风险：**不显示分档列。

**解决办法：**修改列调整逻辑。

#### 22. PGSEdit 3.0 上 format 为 0 时 GetDispFormat 函数执行结果不一致问题

**描述：**PGSEdit 1.0 返回 0.，PGSEdit 3.0 返回 0。

**风险：**新老版本差异。

**解决办法：**修改返回值。

#### 23. TestUI 工位状态切换之后重测流程异常问题

**描述：**测试后进入 Option，将无效的工位变为有效并启动重测，Test UI 会提示并禁止重测。

**风险：**易用性欠佳。

**解决办法：**改进重测流程处理，允许上面描述的状况可以正确地进行重测。

#### 24. PGSEdit3.0 模板添加函数时丢失条件单位和值的可选项

**描述：**模板新加函数条件确是单位和值的可选项。

**风险：**易用性欠佳。

**解决办法：**改进模板添加操作。

#### 25. 叠料报警误触发问题

**描述：**开启叠料卡控功能，同时 SPL 卡控的工位应用范围选择了 All Sites，没有测试的工位也会错误触发报警。

**风险：**误触发叠料报警。

**解决办法：**叠料卡控功能由于其特殊性，只有当前工位的采样数大于最小采样数，此工位才会适用叠料报警。